

電磁相容檢測技術研討會會議紀錄

開會時間：九十三年五月十一日

開會地點：電氣檢驗科技大樓簡報室

主持人：謝簡任技正翰璋

出席人員：詳如簽名單

決議事項：

1. 今年7月1日開始，本局安規及EMC檢驗案件办理流程有重大變革，在此進行宣告：
 - (1) 家電產品之EMC案件目前是由台南分局審理，7月1日起台北地區受理的案件由汐止電磁科審查，各分局受理案件照舊由台南分局審查。
 - (2) 台北地區受理的安規及EMC檢驗案件，大部分將改由汐止電磁科統一審理。往後送件時，安規及EMC兩份報告之產品內部照片若發現不同將判定不合格處理。
 - (3) 今後技術研討會可能分成兩個部分(安規及EMC)召開，至於如何召開(例如上、下午)將重新討論。
2. 系列申請若試驗室判定為免測試件，且電路圖、干擾源及對策元件表確認和原申請一樣，則於系列申請送件時，試驗室可在報告中說明或由廠商切結說明，不必再另行檢附上述文件。
3. 干擾源表中主要干擾元件若增列second source，即使型號規格都一樣，還是須加以驗證。
4. 鑒於舊版資訊產品測試程式，可能無法完全測試所接的週邊，實有檢討更新的必要，請各試驗室於一星期內，提供測試程式給本科龔子文先生，若程式不合於要求，請試驗室進行修改。

討論事項：

1. 因商檢局要求USB 2.0 port的最大架構須全接可讀寫的USB 2.0週邊，這在理論上可能是EMI最大狀況的接法，但根據實務經驗USB 2.0的包覆線材普遍較佳，容易帶出雜訊的反而是USB 1.0的週邊，因此建議商檢局能接受USB 2.0與USB 1.0週邊各用一半的測法，如此也較符合使用者實際使用的情況(實際案例：全接USB 2.0週邊480MHz class B under 6dB，接上一個USB 1.0滑鼠變成over 1.6dB)。目前像Intel等公司的產品也都要求這樣的測試方法。(緯創公司提案)

決議：(1) 依92.06.26會議記錄決議，產品USB 2.0 port的測試，目前同意最少接2個USB 2.0週邊，其餘可接USB 1.1週邊，且原則上應使用可執行 read/write 功能的週邊做測試，並無要求USB 2.0 port須全接可讀寫USB 2.0週邊的情形。

(2) 若試驗室應客戶的需求，在USB 2.0 port的測試時，針對連接不同

數量的USB 2.0、USB 1.1週邊，及可 read/write 或不可 read/write 的週邊均加以驗證，並找出一個worst case配置，則本局可接受此USB週邊配置，惟測試報告須說明清楚，如果案件審核人員有疑問將予以抽測，抽測時審核人員可任意選擇USB 2.0或USB 1.1，及可 read/write 或不可 read/write 的週邊測試。

備註：下次會議日期暫定九十三年六月二十三日